

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	0	roy.in. and interface adj building adj block	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 16:51
-	122	torres.xa. and ((under adj test) DUT CUT LUT UUT)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 08:51
-	20705	(test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin pins interface probe probes socket sockets channel channels)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 09:53
-	14882	(test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. interface.ab. probe.ab. probes.ab. socket.ab. sockets.ab. channel.ab. channels.ab.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 09:56
-	11898	(test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. interface.ab. probe.ab. probes.ab. socket.ab. sockets.ab. channel.ab. channels.ab.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 09:55
-	5202	(test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 09:58
-	4327	(test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 09:59
-	1755	(test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab.) and (pattern vector data)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:01
-	242	((map mapping maps mapped) with (pin pins)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 10:58
-	35	((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab.) and (pattern vector data)) and ((map mapping maps mapped) with (pin pins)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 10:19
-	14	((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab.) and (pattern vector data)) and ((map mapping maps mapped) with (pin pins)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and (test adj program)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:35

-	592	((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 10:59
-	2178	(test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:11
-	49	((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and ((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:42
-	19	((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and ((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))) and (test adj program)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 12:24
-	5	((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and ((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))) and (test adj program)) not (((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))) and (((map mapping maps mapped) with (pin pins)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and (test adj program))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:36

-	30	(((((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and ((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))) not (((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and ((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))) and (test adj program))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:51
-	29	(pin.ab. pins.ab.) and (test adj program).ab. and ((under adj test) CUT LUT MUT UUT DUT semiconductor IC integrated) with (plurality multi multiple)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:59
-	2	4868493.pn.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 11:59
-	1	(((((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and ((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))) and (ATPG)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 12:24
-	1	(((((map mapping maps mapped) with (pin pins port ports)) and ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.)) and ((test.ab. testing.ab. tests.ab. tester.ab. tested.ab.) with ((under adj test).ab. CUT.ab. LUT.ab. MUT.ab. UUT.ab. DUT.ab. semiconductor.ab. IC.ab. integrated.ab.) and (pin.ab. pins.ab. port.ab. ports.ab.) and (pattern vector data))) and (ATPG)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 12:25
-	214	netlist with (pin pins)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 13:07
-	0	(netlist with (pin pins)) and (test adj program).ab. and ((under adj test) CUT LUT MUT UUT DUT semiconductor IC integrated) with (plurality multi multiple)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 16:50
-	19	(netlist with (pin pins)) and ((test adj program) ATPG) and ((under adj test) CUT LUT MUT UUT DUT semiconductor IC integrated) with (plurality multi multiple)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/04/09 13:02
-	1		USPAT	2003/04/09 13:12
-	1		USPAT	2003/04/09 13:12
-	1		USPAT	2003/04/09 13:12
-	1		USPAT	2003/04/09 13:12

-	1	USPAT	2003/04/09 13:12
-	1	USPAT	2003/04/09 13:12
-	1	USPAT	2003/04/09 13:12
-	1	USPAT	2003/04/09 13:13
-	1	USPAT	2003/04/09 13:13
-	1	USPAT	2003/04/09 13:14
-	1	USPAT	2003/04/09 13:15
-	1	USPAT	2003/04/09 13:15
-	1	USPAT	2003/04/09 13:15
-	1	USPAT	2003/04/09 13:16
-	1	USPAT	2003/04/09 13:16
-	1	USPAT	2003/04/09 13:16
-	1	USPAT	2003/04/09 13:16
-	1	USPAT	2003/04/09 13:16
-	1	USPAT	2003/04/09 13:16
-	1	USPAT	2003/04/09 13:17
-	1	USPAT	2003/04/09 13:17
-	1	USPAT	2003/04/09 13:18
-	1	USPAT	2003/04/09 13:18
-	1	USPAT	2003/04/09 13:19
-	1	USPAT	2003/04/09 13:19
-	1	USPAT	2003/04/09 13:19
-	1	USPAT	2003/04/09 13:19
-	1	USPAT	2003/04/09 13:19
-	1	USPAT	2003/04/09 13:20
-	1	USPAT	2003/04/09 13:20
-	1	USPAT	2003/04/09 13:21
-	1	USPAT	2003/04/09 13:21
-	1	USPAT	2003/04/09 13:22
-	1	USPAT	2003/04/09 13:22
-	1	USPAT	2003/04/09 13:22
-	1	USPAT	2003/04/09 13:22
-	1	USPAT	2003/04/09 13:22
-	1	USPAT	2003/04/09 13:23
-	1	USPAT	2003/04/09 13:25
-	1	USPAT	2003/04/09 13:27
-	1	USPAT	2003/04/09 13:27
-	1	USPAT	2003/04/09 13:27
-	1	USPAT	2003/04/09 13:28
-	1	USPAT	2003/04/09 13:28
-	1	USPAT	2003/04/09 13:29
-	1	USPAT	2003/04/09 13:29
-	1	USPAT	2003/04/09 13:29
-	1	USPAT	2003/04/09 13:30
-	1	USPAT	2003/04/09 13:30
-	1	USPAT	2003/04/09 13:30
-	1	USPAT	2003/04/09 13:31
-	1	USPAT	2003/04/09 13:31
-	1	USPAT	2003/04/09 13:31
-	1	USPAT	2003/04/09 13:32
-	1	USPAT	2003/04/09 13:32
-	1	USPAT	2003/04/09 13:32
-	1	USPAT	2003/04/09 13:32
-	1	USPAT	2003/04/09 13:32
-	1	USPAT	2003/04/09 13:33
-	1	USPAT	2003/04/09 13:34
-	1	USPAT	2003/04/09 13:34
-	1	USPAT	2003/04/09 13:34
-	1	USPAT	2003/04/09 13:34
-	1	USPAT	2003/04/09 13:34
-	1	USPAT	2003/04/09 13:34
-	1	USPAT	2003/04/09 13:34
-	1	USPAT	2003/04/09 13:35
-	1	USPAT	2003/04/09 13:35
-	1	USPAT	2003/04/09 13:35
-	1	USPAT	2003/04/09 13:36
-	1	USPAT	2003/04/09 13:36
-	1	USPAT	2003/04/09 13:37
-	1	USPAT	2003/04/09 13:37
-	1	USPAT	2003/04/09 13:37
-	1	USPAT	2003/04/09 13:37

-		1		USPAT	2003/04/09 13:38
-		1		USPAT	2003/04/09 13:38
-		1		USPAT	2003/04/09 13:38
-		1		USPAT	2003/04/09 13:38
-		1		USPAT	2003/04/09 13:38
-		1		USPAT	2003/04/09 13:38
-		1		USPAT	2003/04/09 13:39
-		1		USPAT	2003/04/09 13:39
-		1		USPAT	2003/04/09 13:39
-		1		USPAT	2003/04/09 13:39
-		1		USPAT	2003/04/09 13:40
-		1		USPAT	2003/04/09 13:40
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:41
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:42
-		1		USPAT	2003/04/09 13:43
-		1		USPAT	2003/04/09 13:43
-		1		USPAT	2003/04/09 13:43
-		1		USPAT	2003/04/09 13:43
-		1		USPAT	2003/04/09 13:43
-		1		USPAT	2003/04/09 13:43
-		1		USPAT	2003/04/09 13:48
-		1		USPAT	2003/04/09 13:48
-		1		USPAT	2003/04/09 13:49
-		1		USPAT	2003/04/09 13:49
-		1		USPAT	2003/04/09 13:50
-		1		USPAT	2003/04/09 13:50
-		1		USPAT	2003/04/09 13:51
-		1		USPAT	2003/04/09 13:51
-	28	netlist near pin		USPAT;	2003/04/09 14:15
-	42	"5216361" "6366109" "5025205"		US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB USPÄT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2003/04/09 14:17